Основы высоковакуумной сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии, атомно-силовая микроскопия

План

- 1. Принципы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ)
- 2. Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ)
- 3. Сканирующая атомно-силовая микроскопия (АСМ)
- 4. Применение средств СЗМ в изучении наноматериалов и наноструктур, СЗМ-наноинженерия

Литература





Г. Бинниг, Г. Рорер, «Сканирующая туннельная микроскопия — от рождения к юности», УФН, 154 (2) (1988)

Scanning probe microscopy and spectroscopy: methods and applications by Roland Wiesendanger Cambridge University Press, 1994 ISBN 0521428475, 9780521428477

- Scanning Probe Microscopy Analytical Methods by Roland Wiesendanger, Springer, 1998 ISBN 3540638156, 9783540638155
- Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy: Theory, Techniques, and Applications by Dawn Bonnell (Editor), Wiley-VCH, 2000
- Scanning Probe Microscopy: The Lab on a Tip by Ernst Meyer ,Hans Josef Hug, Roland Bennewitz, Springer-Verlag, 2003, ISBN: 3540431802
- Основы сканирующий зондовой микроскопии, Миронов В. Л., 2004. Твердый переплет. 144 с. цена: 186,00 руб (https://www.books.ru/shop/books/230464)
- Г. Бинниг, Г. Рорер, «Сканирующая туннельная микроскопия от рождения к юности», УФН, 154 (2) (1988)
- http://www.ntmdt.ru/spm-basics
- http://www.veeco.com/library/
- http://www.almaden.ibm.com/vis/stm/
- http://www.nanoscience.de/group_

Оптический микроскоп





 Дифракционный предел разрешения:

$$d = \frac{\lambda}{2 n \sin \alpha} \approx \frac{\lambda}{2 \text{ NA}}$$

$$NA = n \sin \theta$$

• апертура объектива 0.95 на воздухе, 1.5 в масле

Оптический микроскоп даже с самой совершенной оптикой не может различить об'екты меньшие половины длины световой волны: две параллельные линии, расположенные ближе чем 0.3 µm, будут видны как одна линия.

Электронный микроскоп



фокусируемый электронный луч

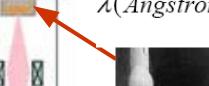
Дифракционный предел разрешения:

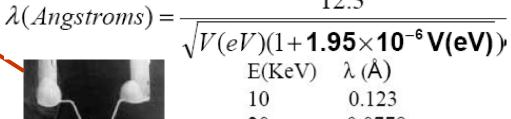
$$d = \frac{\lambda}{2 n \sin \alpha} \approx \frac{\lambda}{2 \text{ NA}}$$

$$NA = n \sin \theta$$

Де-бройлевская длина волны электрона $\lambda = h/p$:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0qV(1+qV/2m_0c^2)}}$$



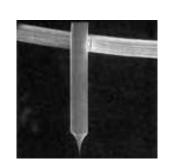


20 0.0778 0.0657

термоэлектронный эмиттер

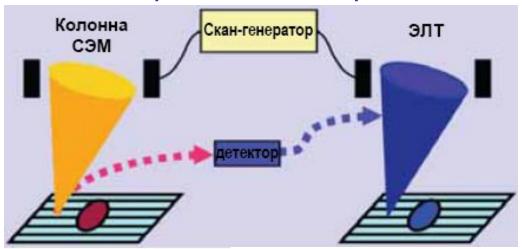


сканирующий электронный луч



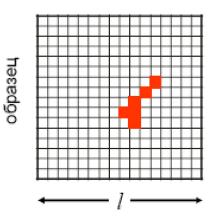
автоэлектронный эмиттер

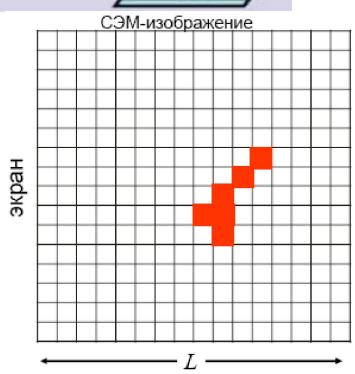
СЭМ: принцип сканирования



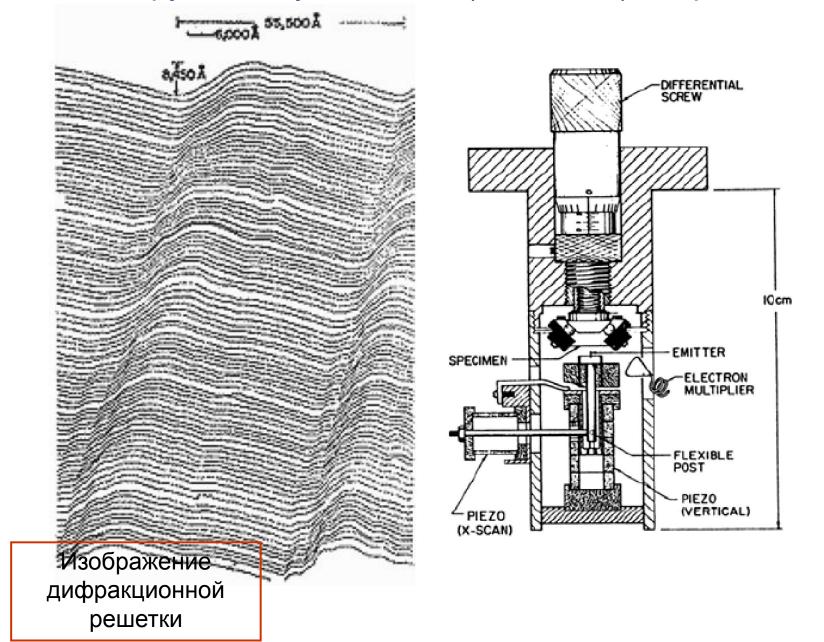
• Принцип сканирования: увеличение *M =L/I*

сканируемая область

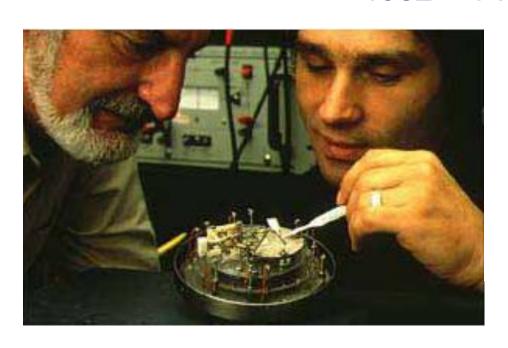




Сканирующий туннельный (зондовый) микроскоп



1982 – 1-й CTM



Генрих Рорер Герд Бинниг





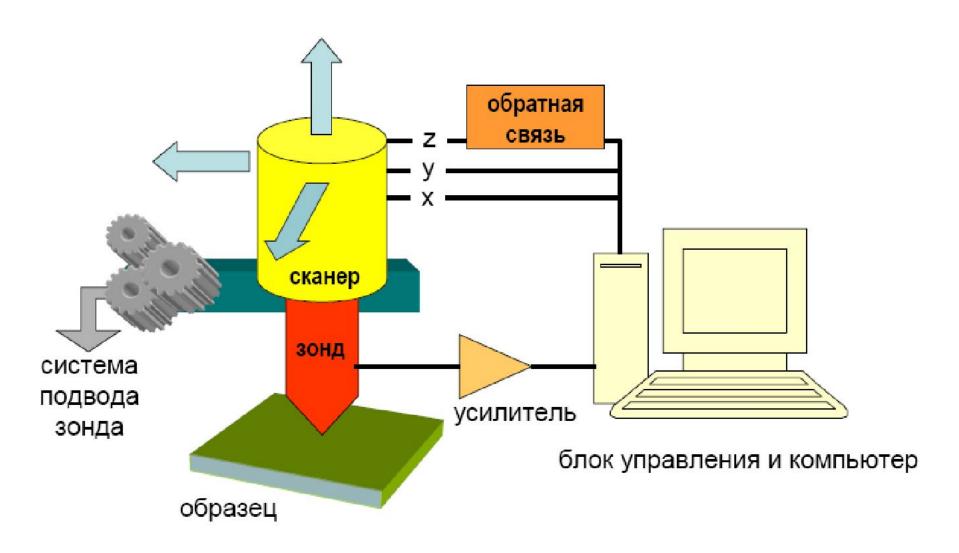


Нобелевская премия по физике (вместе с Эрнстом Руска) 1986

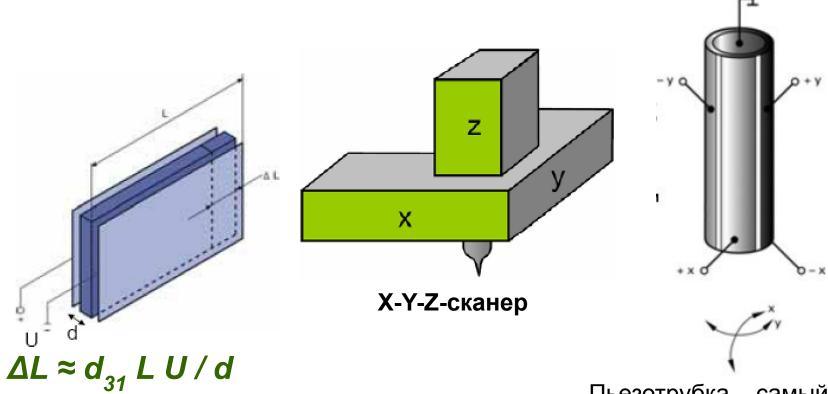
Что такое «сканирующий зонд»?



Основные элементы СЗМ



Пьезосканер

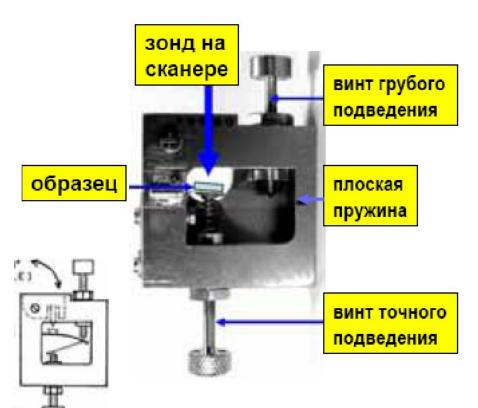


пьезокоэффициент $d_{31} \sim -200 \text{ пм/B}$

Пьезотрубка – самый распространенный X-Y-Z-сканер

Подведение зонда к образцу

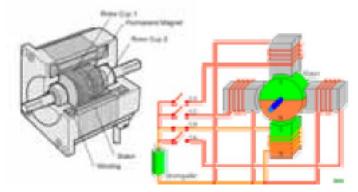
Механическая система



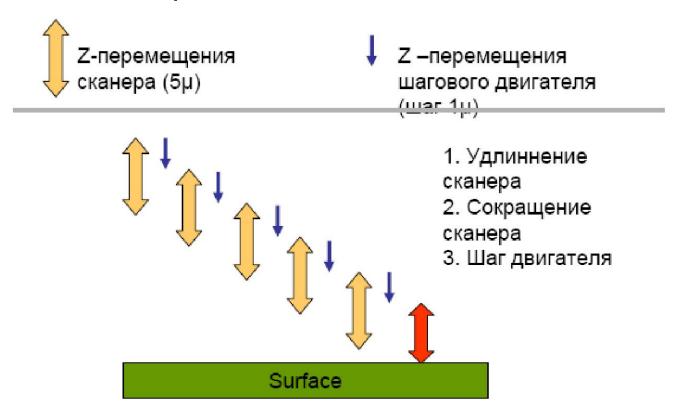
Электромагнитный шаговый двигатель



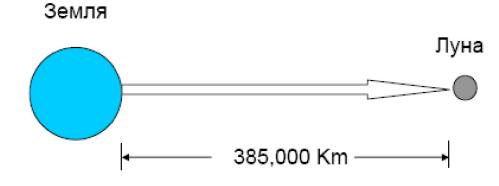
вращает винт точного подведения

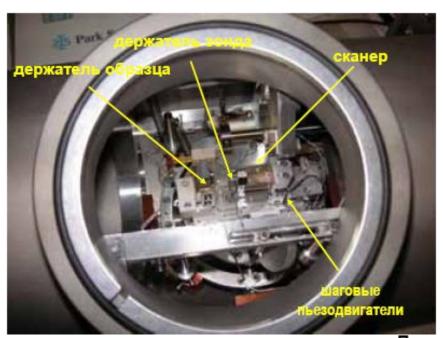


Алгоритм подведения зонда



 Подведение зонда к образцу с первоначального расстояния от поверхности 1мм до расстояния 0.1 нм (за 1 минуту) эквивалентно полету к Луне с остановкой на высоте 40м над ее поверхностью (со скоростью 23 миллионов км/час)





Примеры СЗМ и СТМ



миниатюрный **CTM EasyScan**(NanoSurf)

Производство российской фирмы НТ МДТ

Головка сверхвысоковакуумного СЗМ "VP-2" (Veeco)

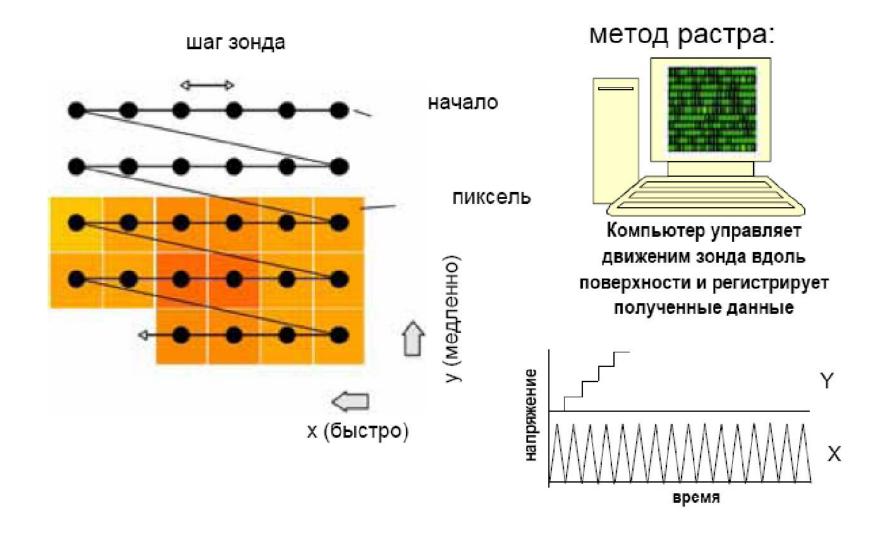


ИНТЕГРА



СОЛВЕР Р47H-PRO

Принцип сканирования

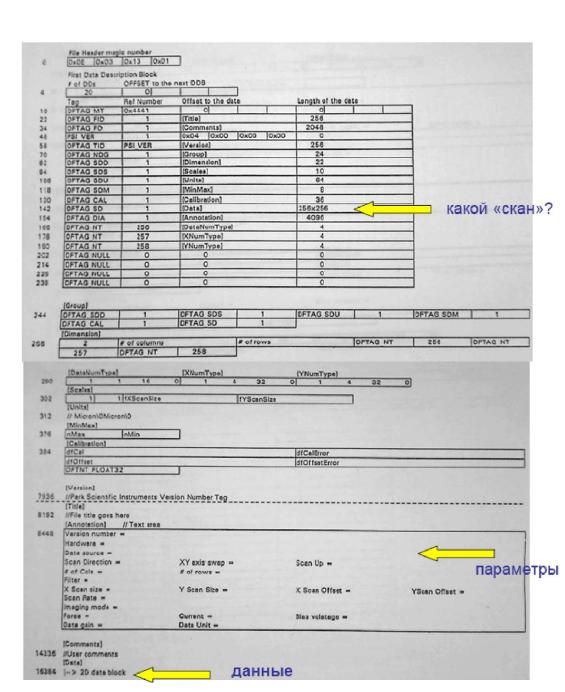


Формат данных в СЗМ

HDF - Hierarchical Data
 Format (Иерархический формат данных) разрабатываемый The National Center for Supercomputing Applications

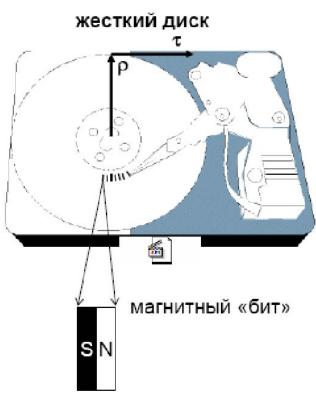
(http://www.ncsa.uiuc.edu) с ://www.ncsa.uiuc.edu) с 1987г. и довольно широко используемый в настоящее время научным сообществом: http://www.hdfqroup.org/

- Географические информационные системы (ГИС) и дистанционное зондирование Земли
- http://gis-lab.info/docs/hdf.htm



жесткий диск т

Представление СЗМ данных



МСМ изображение одного бита записанной информации

